

△の数	訂正記事	担当	検図	年月日	△の数	訂正記事	担当	検図	年月日
△					△				
△					△				
適用規格									
定格	使用温度範囲	-55℃～85℃（注1）			保存温度範囲	-10℃～60℃（注2）			
	電圧	AC 100 V			使用湿度範囲	40 %～80 %			
	電流	0.4 A			保存湿度範囲	40 %～70 %（注2）			
性能									
	項目	試験方法			規格			QT	AT
構造	外観、構造及び仕上げ	目視、寸法測定器にて測定する。			図面と合致していること。			○	○
	表示	目視にて確認する。						○	○
電気的 性能	接触抵抗	100 mA（DC 又は 1000 Hz）で測定する。			45 mΩ以下			○	—
	低電圧、低電流下の 接触抵抗	20 mV以下、1 mA（DC または 1000 Hz）で 測定する。			55 mΩ以下			○	—
	絶縁抵抗	DC 250 Vで測定する。			100 MΩ以上			○	—
	耐電圧	AC 300 Vの電圧を1分間印加する。			せん絡・絶縁破壊がないこと。			○	—
機械的 性能	繰り返し動作	50 回の抜き差しを行う。			① 接触抵抗： 55 mΩ以下 ② 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	耐振性	周波数 10～55 Hz、振幅 1.5 mm、 3 方向各 2 時間試験する。			① 1 μs以上の電氣的瞬断がないこと。 ② 接触抵抗： 55 mΩ以下			○	—
	耐衝撃性	加速度 490 m/s ² 、持続時間 11 ms、 正弦半波 3方向各 3 回試験する。			③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
環境的 性能	定常状態の耐湿性	温度 40±2℃、湿度 90～95%中に 96 時間放置する。			① 接触抵抗： 55 mΩ以下 ② 絶縁抵抗： 100 MΩ以上			○	—
	温度サイクル	温度 -55→+15→+35→+85→+15→+35℃ 時間 30→2～3→30→2～3 分 を 5 サイクル試験する。			③ 破損、ひび、部品のゆるみがないこと。			○	—
	塩水噴霧	濃度 5 % の塩水、48 時間放置する。			① 接触抵抗： 55 mΩ以下			○	—
	硫化水素	濃度 3 ppm、96 時間放置する。 （試験規格：JEIDA 38）			② はなはだしい腐食がないこと。			○	—
	はんだ耐熱性	リフローの場合：ピーク温度 MAX250℃ 220℃以上 60秒以内			外観の変形及び端子などに著しい ガタがないこと。			○	—
		はんだごての場合：こて温度 360±10℃ はんだ付け時間 5 秒以内						○	—
	はんだ付け性	はんだ温度 240±5℃、浸せき時間 3 秒間のはんだ付けを行う。			はんだ浸せき面の 95 %以上が 新しいはんだでぬれていること。			○	—
備考									
注1. 通電時の温度上昇を含みます。					製図				
注2. ここでの保存とは、基板搭載前の未使用品に対する長期保管状態を表します。					担当				
					検図				
					承認				
					出図				
試験規格の記載のない試験方法はJIS C 5402を適用している。					HIF 05.02.17 土井				
注 QT:確認試験 AT:製品検査 ○:適用項目					HIF 05.2.17 土井				
					HIF 05.2.17 小沢				
					HIF 05.2.17 大川				
HRS ヒロセ電機株式会社 HIROSE ELECTRIC CO., LTD.					製品規格表				
製品名					FX8-※※P-SV（71）				
旧CL					製品コード				
CL					CL578				
図番					1				
SLC4-150726-25					1				